Title of Invention: Crystal Defect Compensating Circuit

Utility Model Publication No.: S63-185355

Publication Date: November 29, 1988

Filing No.: S62-76677

Filing Date: May 21, 2005

Name of Inventor: Yoshinori Takagi

Applicant: Sharp Corporation

Abstract

A crystal defect compensating circuit includes: a mosaic-shaped color filter; solid imaging elements to which color separation images are projected; a first sampling circuit for sampling the image by each pixel; a second sampling circuit for sampling each pixel arranged every a repetition unit pitch of the color filter; and a frequency characteristic control circuit. When sampling a defect pixel, the defect is compensated by a sampling output of the second sampling circuit, and the frequency characteristic control circuit is activated to control the frequency characteristic at a pixel area including the defect pixel to be lowered.

⑲ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

[®] 公開実用新案公報(U)

昭63-185355

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988)11月29日

5/217 5/335 H 04 N

9/07

8420-5C P-8420-5C A-8321-5C

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

結晶欠陥補償回路

②実 額 昭62-76677

❷出 願 昭62(1987)5月21日

砂考 案 者

高 木 美 則

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャープ株式会社 砂出 願 人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

②代 理 人 弁理士 山口 邦夫

1. 考案の名称

結晶欠陥補徵回路

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) モザイク状の色フィルタと、

その色分解像が投影される固体撮像素子と、

画素ごとにサンプリングする第1のサンプリング回路と、

上記色フィルタの単位繰り返しピッチに対応した画素ごとにサンプリングする第2のサンプリング
グ回路と、

周波数特性制御回路とを有し、

欠陥画素のサンプリング時、上記第2のサンプリング時、上記第2のサンプリング出力によって欠陥補償されると共に、上記周波数特性制御回路を動作させて、欠陥画素を含む画素領域でその周波数特性が低下するように側御されるようにしたことを特徴とする結晶欠陥補償回路。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この考象は、CCDなどの電荷転送素子を固体 撮像素子として使用したビデオカメラに適用して 好適な結晶欠陥補償回路に関する。

[従来の技術]

國体擬像素子として、CCDなどのような電荷転送素子を使用する場合にあっては、その基体である半導体素子に結晶欠陥があると、その結晶欠陥部分に対応した画素からは常時欠陥ノイズが発生する。この欠陥ノイズによって画質低下を招来していた。

この画質低下を改善するため、従来では結晶欠 陥補償国路を使用している。これは、結晶欠陥部 分を前値ホールドする方式である。

第3図はこの前値ホールド方式の結晶欠陥補償回路10の従来例を示す。

固体撮像素子1としては、CCDを使用した場合であって、このCCD1から読み出された撮像信号は、サンプリングホールド回路2において、



画素ごとに撮像信号の信号レベルがホールドされる。従って、出力端子3には波形成形された撮像信号が得られる。

4はサンプリングタイミングを制御するための制御回路であって、これにはメモリが設けられており、ここにCCD1のどの部分に結晶欠陥があるのかを示す位置信号が記憶されている。

通常は端子5に供給されたサンプリングパルスがゲート回路6を介してサンプリングホールド回路2に供給されるようになされている。

結晶欠陥のある位置が到来すると、制御回路4から阻止信号が送出される。それによって、ゲート回路6が動作してサンプリングパルスが阻止されて、サンプリング動作が停止する。

これによって、1両素前の信号がそのままホールドされるから、欠陥ノイズが出力されることはない。

ところで、色フィルタとしてモザイク状をなす 例えば補色フィルタを使用するような場合には、 上述したような前値ホールド方式の結晶欠陥補償



回路では、有彩色時結晶欠陥を完全に補償することができなくなる。

例えば、色フィルタとして第4図に示すような モザイク状の補色フィルタを考えると、輝度信号 は隣接する2水平ラインの撮像信号の和信号が使 用される。すなわち、奇数ラインでは、

$$Y n = (M z + C y) + (G + Y 1)$$

= 2 (R + G + B)

偶数ラインでは、

$$Y n + 1 = (Mz + Y + 1) + (G + Cy)$$

= 2 (R + G + B)

これに対して、色信号は、隣接する 2 水平ラインの撮像信号の差信号が使用される。すなわち、奇数ラインでは、

$$Y n = (Mz + Cy) - (G + Y1)$$

= 2 B + G

偶数ラインでは、

$$Y n + 1 = (Mz + Y1) - (G + Cy)$$

= 2 B - G

このような色フィルタを使用して色分解を行なっ



ている場合には、上述したような 1 画素的のサンプリングホールド出力を結晶欠陥補償信号として使用すると、 1 画素前の色信号が輝度誤差となってしまう。すなわち、結晶欠陥部分と等価な信号で補償することができない。

上述したような色フィルタでは、水平走査方向におけるフィルタの単位繰り返しビッチだけ前の 撮像信号を結晶欠陥補償信号として使用する必要 があるからである。

例えば、第4図のような色フィルタでは、2両 素ごとに同一の色フィルタが並んでいるので、2 画素前(2ピット前)の最像信号によって補償し なければならない。

[考案が解決しようとする問題点]

ところで、このように単位繰り返しピッチ前の 撮像信号を結晶欠陥補償信号として使用するよう に、結晶欠陥補償回路を構成する場合にあっても、 結晶欠陥を完全には補償できないことがある。

それは、実装上、各サンプリングバルスの位相 差や、サンプリングホールド回路のパラツキなど



の影響によって、僅かな D C 差やサンプリングパルスの漏れが発生する。

このようにDC差やサンプリングパルスの漏れ 量が相違したりすると、これらが欠陥補償誤差となり、結果的に結晶欠陥部分にノイズが重畳されてしまうことになる。

そこで、この考案ではこのような従来の問題点を解決したものであって、モザイク状をなす補色フィルタを色フィルタとして使用する場合であっても、結晶欠陥を確実に補償することのできる結晶欠陥補償国路を提案するものである。

[問題点を解決するための技術的手段]

上述の問題点を解決するため、この考案においては、モザイク状の色フィルタと、その色分解像が投影される固体撮像素子と、画素ごとにサンブリング可路と、色フィルタの単位繰り返しピッチに対応した画素ごとにサンプリングする第2のサンプリング回路と、周波数特性制御回路とで、結晶欠陥補償回路が構成される。

[作用]

通常動作時は、第1のサンプリング回路によって 服像信号が画素ごとにサンプリングされる。

これに対して、欠陥画素のサンプリング時、第 2のサンプリング回路が動作する。これによって、 その出力側には、色フィルタの単位繰り返しピッ 手前の撮像信号がそのまま、サンプリングホール ド出力として使用される。

このサンプリングホールド出力は結晶欠陥のない画素から得られた振像信号であって、しかもその色成分は同一である。

この結晶欠陥補償動作と共に、周波数特性制御 回路を動作させて、欠陥回素を含む前後の画素領 域でその周波数特性が低下するように制御される。

これによって、DC差やサンプリングパルスの 漏れ量の相違によるノイズが発生しても、そのレ ベルが抑制されて、目立たなくなる。

[実施例]

続いて、この考案に係る結晶欠陥補償回路の一 例を上述したビデオカメラに適用した場合につき、



第1図以下を参照して詳細に説明する。

第1図は結晶欠陥補償回路10の一例を示し、 第2図は結晶欠陥補償動作の説明に供する波形図 である。

第2図 A は、振像素子としてCCDを使用したときの振像信号の一例を示す。同図において、斜線で示す S 1~ S 5 は各画素に対応した振像信号であって、この例では 4 番目の画素に結晶欠陥がある場合を示す。そのため、N はこの結晶欠陥によって発生するノイスを表す。

Tは水平走査方向に対する転送周期(水平転送周期)である。Toは信号のリセット期間、T1はフィードスルー期間を示す。リセット期間Toのとき、信号レベルは所定の電源レベルまでプルアップされる。

さて、第1図において、CCD1から出力された版像信号は高速動作をするクランプ回路11でフィードスルー期間 T1が高速クランプ処理される。第2図Bに示すクランプパルス Po はタインミング発生回路30で生成されたものが使用され



3 .

サンプリングされた撮像信号はパッフアアンプ14を介してインパータ16に供給されて、信号の位相が反転され、反転された撮像信号がローバスフィルタ17において帯域制限される。帯域制限された撮像信号は後述する周波数特性制御路32によって最の制御される。その制度の周波数特性と周波数帯域を持った撮像信号、つまり映像信号が得られる。

なお、33は周波数特性を微調整するための可 変素子である。

この考案においては、第1のサンプリングホールド回路 13に対して並列に、第2のサンプリングホールド回路 21、パッファアンプ 22及びスイッチング回路 24の直列回路 20が接続される。



直列回路20は結晶欠陥を補償するための回路 系である。従って、通常は第1のサンプリングホールド回路13が使用され、欠陥画器の撮像信号を 出力するときには、この直列回路20が始めて動作することになる。

そのため、第1のサンプリングホールド回路13には第2図Cに示すように、結晶欠陥画素のときサンプリング動作しないような時系列のサンプリングパルスP1が供給される。この第1のサンプリングパルスP1はタインミング発生回路30で生成されたパルスが使用される。

タインミング発生回路30には、上述したように結晶欠陥位置を記憶したメモリが設けられ、結晶欠陥画業からの信号読み出しタイミングに同期して、サンプリングパルスが欠如するようになされている。

タインミング発生回路 3 O ではさらに第2のサンプリングパルス P 2 が生成される。この第 2 のサンプリングパルス P 2 は、第2 図 D に示すように、結晶欠陥位置の画素を含めて 2 画素前から



サンプリングパルスが欠如するようなパルス列である。

何個のパルスを欠如させるかは、色フィルタの 構成によっても相違する。すなわち、間引くべき パルス数は色フィルタの水平走査方向におけるフィ ルタの単位繰り返しピッチによって決まる。

第4図のような補色フィルタでは2両素を単位 として色フィルタが繰り返されているので、この 場合には2両素分のサンプリングパルスが間引か れる。

これに対して、スイッチング回路 2 4 には、結晶 欠陥 位置に対応したスイッチングパルス P 3 (第 2 図 E) が供給される。

ここで、第1、第2のサンプリングバルスP1、P2及びスイッチングバルスP3は何れも、ハイレベルでサンプリング動作及びスイッチング動作を開始するものとする。

従って、第1のサンプリングホールド回路13 では結晶欠陥画素のところだけ、サンプリング動 作が停止する。これに対して、第2のサンプリン



グホールド回路21では、結晶欠陥画素を含めて 2両素前までは第1のサンプリングホールド回路 13と同様なサンプリング動作であるが、結晶欠 陥画素及びその1画素前はサンプリング動作は行 なわれない。

また、スイッチング回路24はスイッチングパルスP3が得られたときだけ、オンするようになされているから、パッファアンプ14への入力信号としては、結晶欠陥画器の1画素前までは第1のサンプリングホールド回路13の出力が供給される。

しかし、結晶欠陥画素のタインミングでは、第 1のサンプリングホールド回路13の出力に代えて、スイッチング回路24の出力が供給されることになる。スイッチング回路24では2画素前の 最像信号がホールドされた状態にあるから、2画素前の撮像信号S2がパッファアンプ14に入力することになる(第2図F)。

その結果、ノイズNは伝送されない。

なお、上述したようにサンプリング位相の僅か



な相違などによって、サンプリング出力中にサンプリングパルスが漏れたようなときには、インパータ 1 6 の出力 E 2 を みると、出力波形の連続性が担保されず、第2 図 G ような出力波形となってしまう。

そのため、ローパスフィルタ17によって高域を除去しても、サンプリングパルスの漏れ量によっては大きな出力レベル変動となって現れてしまう。この漏れ量は特に、結晶欠陥画素のところが著しい。出力E2が第2図Gのときには、ローパスフィルタ17の出力E1は同図Hのようになる。

そこで、この考案ではさらに、スイッチングパルスP3がパルス遅延回路31に供給されて、1 個素分に相当する時間だけ遅延されて、第2図Iに示すような遅延パルスP4が形成され、これが利得制御信号として周波数特性制御回路32に供給される。

これによって、遅延パルスP4が得られている期間、撮像信号の利得を下げる。どの程度下げるかは、サンプリングバルスの漏れ量などを考慮して



定められる。このように利得を調整すれば、出力 端子3に得られる最終的な映像信号の出力レベル Eoは第2図Jのごとくなって、大幅な出力レベ ル変動を除去できる。

[考案の効果]

以上説明したように、この考案においては、補色フィルタのような色フィルタを使用したときの結晶欠陥に対する補償を行なうと共に、実装上の問題点であった、サンプリングパルスの漏れによって生ずるノイズを周波数特性を制御することによって軽減したものである。

これによれば、再生画像の画質が著しく改善される。

従って、この考案に係る結晶欠陥補償回路は上述したように電荷転送素子を撮像素子として使用すると共に、補色フィルタのような色フィルタを使用したビデオカメラに適用して極めて好適である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案に係る結晶欠陥補償回路の一例を示す系統図、第2図はその動作説明に供する 波形図、第3図は従来の結晶欠陥補償回路の系統 図、第4図は色フィルタの構成図である。

1・・・固体撮像素子

10・・・結晶欠陥補償回路

13・・・第1のサンプリングホールド回路

20・・・結晶欠陥補償用の直列回路

21・・・第2のサンプリングホールド 国路

24・・・スイッチング 回路

30・・・タインミング発生回路

3 1 ・・・パルス遅延回路

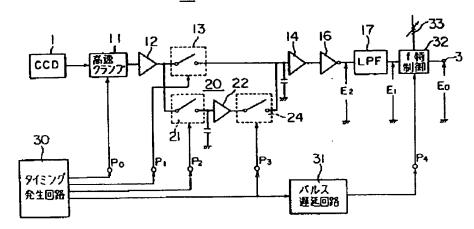
32・・・周波数特性制御圓路

実用新案登録出願人 シャープ 株式会社 代 理 人 弁理士 山口 邦夫 出籍 におまま



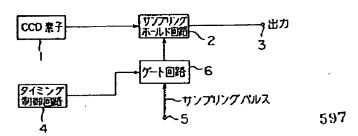
第1図

10: 結晶欠陥補償回路

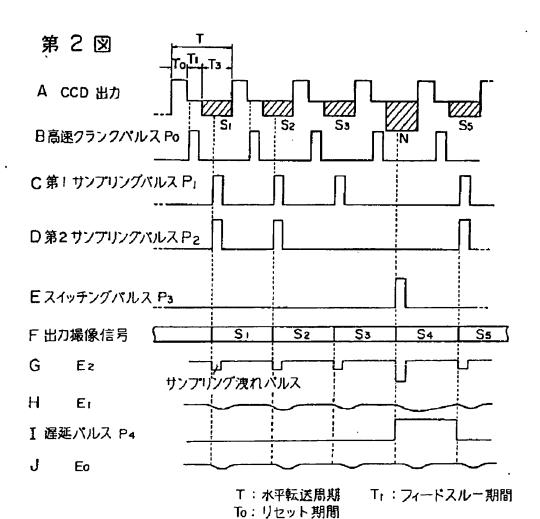


第3図

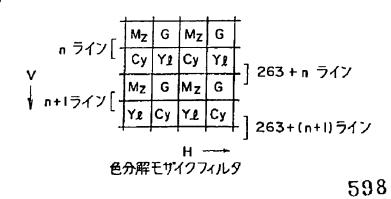
10: 結晶欠陥補償回路



実開 63-185355



第4図



実開 63-185355

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.